



モバイル機器の
高加速度衝撃試験

セミナー
開催

1月30日(火)14:00~
『落下衝撃 試験の基礎ゼミ』

セミナー申込

本メールマガジンでは[高加速度発生装置 HGP シリーズ](#)をご紹介します。
デモ見学も可能ですので、是非、[お問い合わせ](#)ください。

モバイル電子機器の品質管理は出来ていますか？

スマートフォンやタブレット端末など、あらゆるモバイル電子機器は、その操作中に誤って落下させてしまうと、その機器に内蔵されている各部品（基板、コネクタ、バッテリー、IC 部品など）には、**瞬間的に数千 G 以上の高加速度が発生**し、製品が破損してまいります。このようなモバイル機器の落下衝撃事象に対する品質管理を行うためには、[高加速度衝撃試験](#)を行う必要があります。

神栄テクノロジーではこのような高加速度衝撃試験にも対応するため、[高加速度発生装置 HGP シリーズ](#)を販売しています。HGP シリーズは衝撃試験機のオプションの位置づけとなる装置で、既存の衝撃試験機の衝撃テーブルに取り付けるだけで、**最大 30,000G (HGP-150 使用時) までの高加速度を発生することが可能**です。

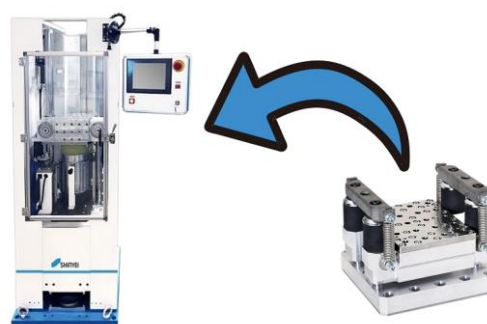
HGP シリーズの主な仕様

型式	HGP-20	HGP-150
衝撃波形	正弦半波	正弦半波
最大加速度(G)	5,000@0.2ms	30,000@0.05ms
衝撃台サイズ (mm)	W170 × D160	W150 × D150
供試品最大質量 (kg)	3	5
本体寸法 (mm)	W343 × D230 × H636	W235 × D223 × H188

使用方法

衝撃試験装置の衝撃台上に本装置を固定し落下させて、高加速度を発生させます。詳細は下記の製品サイトをご参照ください。

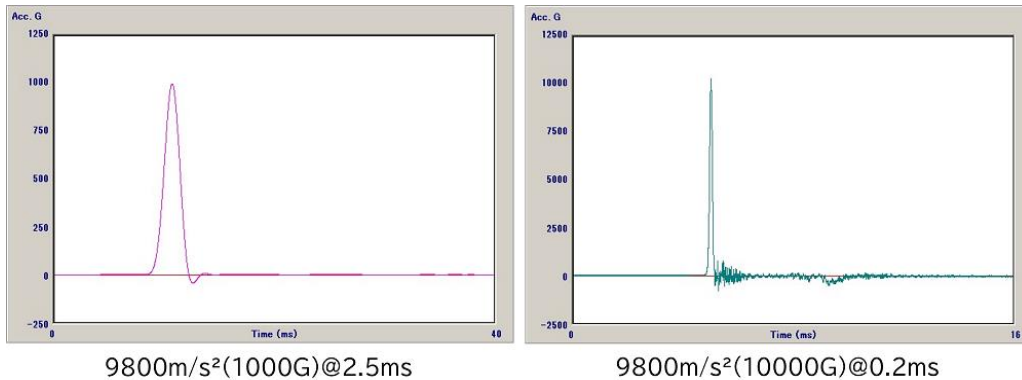
- ・[衝撃試験装置 PDST シリーズ](#)
- ・[高加速度発生装置 HGP シリーズ](#)



波形データ

下は参考波形データです。

HGP-150 で発生する衝撃パルスはノイズが少なく、高い再現性があります。



[お問い合わせはこちらから](#)

お役立ちコンテンツ

各種コンテンツも是非ご利用ください！

- [製品専用サイト](#)
 - [試験機・計測機器](#)
 - [パーティクルセンシングモニター](#)
 - [ハンディにおいモニター](#)
 - [物流ロガー G-TAG シリーズ](#)
 - [水分活性測定](#)
- [カタログ・ソフトウェア・取扱説明書ダウンロードページ](#)
- [アプリケーションノート・ホワイトペーパー](#)
- [YouTube](#)
- [メルマガアーカイブ](#)

- [ライブセミナー](#)
- [オンデマンドセミナー](#) **NEW!**

お問い合わせ

製品または本メルマガに関するお問い合わせは[こちら](#)よりお願いいたします。